

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60512-10-4

Deuxième édition
Second edition
2003-08

**Connecteurs pour équipements électroniques –
Essais et mesures –**

Partie 10-4:

**Essais d'impact (composants libres),
essais d'impact sous charge statique
(composants fixes), essais d'endurance
et essais de surcharge –**

Essai 10d: Surcharge électrique (connecteurs)

**Connectors for electronic equipment –
Tests and measurements –**

Part 10-4:

**Impact tests (free components), static load
tests (fixed components), endurance tests
and overload tests –**

Test 10d: Electrical overload (connectors)



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60512-10-4:2003

Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- Site web de la CEI (www.iec.ch)
- Catalogue des publications de la CEI

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI (www.iec.ch/searchpub) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

- IEC Just Published

Ce résumé des dernières publications parues (www.iec.ch/online_news/justpub) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.

- Service clients

Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- IEC Web Site (www.iec.ch)
- Catalogue of IEC publications

The on-line catalogue on the IEC web site (www.iec.ch/searchpub) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. On-line information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.

- IEC Just Published

This summary of recently issued publications (www.iec.ch/online_news/justpub) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.

- Customer Service Centre

If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60512-10-4

Deuxième édition
Second edition
2003-08

**Connecteurs pour équipements électroniques –
Essais et mesures –**

**Partie 10-4:
Essais d'impact (composants libres),
essais d'impact sous charge statique
(composants fixes), essais d'endurance
et essais de surcharge –
Essai 10d: Surcharge électrique (connecteurs)**

**Connectors for electronic equipment –
Tests and measurements –**

**Part 10-4:
Impact tests (free components), static load
tests (fixed components), endurance tests
and overload tests –
Test 10d: Electrical overload (connectors)**

© IEC 2003 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

G

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES – ESSAIS ET MESURES –

Partie 10-4: Essais d'impact (composants libres), essais d'impact sous charge statique (composants fixes), essais d'endurance et essais de surcharge – Essai 10d: Surcharge électrique (connecteurs)

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente, les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60512-10-4 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs, du comité d'études 48 de la CEI: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour équipements électroniques.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 1996, dont elle constitue une révision technique.

Cette norme doit être lue conjointement avec la CEI 60512-1 et la CEI 60512-1-100 qui explique la structure de la série CEI 60512.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT –
TESTS AND MEASUREMENTS –****Part 10-4: Impact tests (free components), static load tests
(fixed components), endurance tests and overload tests –
Test 10d: Electrical overload (connectors)**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60512-10-4 has been prepared by subcommittee 48B: Connectors, of IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for electronic equipment.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1996 and constitutes a technical revision.

This standard is to be read in conjunction with IEC 60512-1 and IEC 60512-1-100 which explains the structure of the IEC 60512 series.

La modification technique majeure par rapport à l'édition précédente consiste en la révision de la méthode d'essai pour en faire plus distinctement une méthode de mesure. Le résultat d'essai de cette méthode est une courbe du courant de surcharge en fonction du temps, pour le contact à une température maximale d'environnement spécifiée et pour le connecteur à une température maximale spécifiée.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
48B/1350/FDIS	48B/1368/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2004-12. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60512-10-4:2003

The main change with respect to the previous edition is that the test method has been revised so that it is more clearly a measuring procedure, showing as the test result a plot of overload current over time for the contact under specified maximum environmental temperature and a specified maximum temperature for the connector.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
48B/1350/FDIS	48B/1368/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2004-12. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60512-10-4:2003

CONNECTEURS POUR ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES – ESSAIS ET MESURES –

Partie 10-4: Essais d'impact (composants libres), essais d'impact sous charge statique (composants fixes), essais d'endurance et essais de surcharge – Essai 10d: Surcharge électrique (connecteurs)

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEI 60512 est applicable à l'essai de surcharge électrique des paires de contacts de connecteurs accouplés.

L'objet de cet essai est d'établir une méthode d'essai normalisée pour évaluer le comportement de paires de contacts de connecteurs accouplés parcourus par un courant de surcharge pendant une durée limitée comprise entre 100 ms et 20 s.

La procédure d'essai est basée sur la mesure de l'augmentation de température au cours de la période de temps spécifiée lorsque le courant de surcharge est appliqué aux contacts.

L'augmentation de température en fonction du temps est mesurée pour un courant de surcharge électrique spécifié, multiple entier du courant assigné et le graphique du courant de surcharge en fonction du temps est établi.

NOTE L'expérience a montré que, pour des périodes de temps limitées, les contacts peuvent acheminer un multiple du courant maximal admissible sans dommage pour la zone de contact.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60512 (toutes les parties), *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures*

CEI 60512-1-100, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 1-100: Généralités – Publications applicables*

3 Préparation des spécimens

Les connecteurs doivent être câblés avec un fil de section maximale acceptable par le contact et, sauf indication contraire de la spécification particulière des longueurs de fil les plus courtes possibles compatibles avec l'arrangement de contact.

Les contacts de même taille dans une paire de connecteurs doivent être reliés en série.

Au moins 3 connecteurs accouplés doivent être essayés.

CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT – TESTS AND MEASUREMENTS –

Part 10-4: Impact tests (free components), static load tests (fixed components), endurance tests and overload tests – Test 10d: Electrical overload (connectors)

1 Scope and object

This part of IEC 60512 applies to the electrical overload test of mated contact pairs of connectors.

The object of this test is to draw up a standard method to assess the performance of mated contact pairs of connectors with an electrical overload current flowing through them for a limited period of time between 100 ms and 20 s.

The test procedure is based on measuring the increase of temperature during the specified period of time when the electrical overload is applied to the contacts.

Temperature increase over time is measured for an electrical overload current, specified as an integer multiple of the rated current, and an overload current-over-time diagram is plotted.

NOTE Practice shows that, for limited periods of time, contacts can conduct a multiple of the maximum permissible current without damage to the contact area.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60512 (all parts), *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements*

IEC 60512-1-100, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 1-100: General – Applicable publications*

3 Preparation of specimens

The connector shall be wired with the maximum wire size for the contacts and, unless otherwise specified in the detail specification, the shortest possible wire lengths compatible with the contact arrangement.

Contacts of the same size in a connector set shall be wired in series.

At least three mated connectors shall be tested.

4 Méthode d'essai

Le courant de surcharge doit être un multiple entier du courant assigné donné dans la spécification particulière. Ce courant de surcharge doit être appliqué durant une certaine durée puis doit être coupé dès que la température a atteint la limite supérieure de température définie dans la spécification particulière.

Le retour des échantillons en essai dans les conditions de température du laboratoire doit être atteint avant que le cycle suivant soit effectué.

L'essai doit être répété avec différents courants de surcharge afin de tracer les courbes température – temps comme montrées à la Figure A.1. Au moins 5 valeurs différentes de courant de surcharge – temps dans l'étendue des durées considérées de 100 ms à 20 s doivent être choisies pour tracer la courbe de la Figure A.2.

Au moins trois échantillons doivent être essayés et l'échantillon avec le taux d'augmentation de température le plus rapide doit être choisi pour le graphique du courant de surcharge.

5 Mesures et exigences

Les spécimens doivent être vérifiés par les essais suivants, sauf indication contraire de la spécification particulière,

- Essai 2a (résistance de contact – méthode du niveau des millivolts) de la CEI 60512;
- Essais 13a (forces d'accouplement et de désaccouplement) ou 13b (forces d'insertion et d'extraction) de la CEI 60512;
- Essai 1a (examen visuel) de la CEI 60512.

Il convient de porter une attention à toute indication de détérioration de la surface de contact et du boîtier ou suivant les indications de la spécification particulière.

6 Détails à spécifier

Quand cet essai est requis par la spécification particulière, les détails suivants doivent être précisés:

- a) nombre de spécimens et de contacts à essayer;
- b) type et section du fil utilisé;
- c) points de mesure et méthode (thermocouple) de mesure de la température;
- d) limite supérieure de température;
- e) courant assigné et le courant de surcharge des spécimens;
- f) mesures et exigences;
- g) toute dérogation à la méthode d'essai normalisée.

4 Test method

Overload current shall be an integer multiple of the rated current specified in the detail specification. This overload current shall be applied for a period of time and shall be switched off as soon as the temperature has reached the upper temperature limit defined in the detail specification.

Recovery of the samples under test to laboratory temperature conditions shall be achieved before the next cycle is carried out.

The test shall be repeated with different overload currents to plot temperature-time curves as shown in Figure A.1. At least five different overload current-time values in the considered time range from 100 ms to 20 s shall be selected to plot the curve in Figure A.2.

At least three samples shall be tested and the sample with the fastest temperature-increasing rate shall be selected for the overload current plot.

5 Measurements and requirements

The specimen shall be checked by the following tests, unless otherwise specified in the detail specification.

- Test 2a (contact resistance – millivolt level method) of IEC 60512;
- Tests 13a (engaging and separating forces) or 13b (insertion and withdrawal forces) of IEC 60512;
- Test 1a (visual examination) of IEC 60512.

Attention should be given to any indication of deterioration of the contact surface and housing or as specified in the detail specification.

6 Details to be specified

When this test is required by the detail specification, the following details shall be specified:

- a) number of specimens and contacts to be tested;
- b) type and size of wire used;
- c) test points and method (thermocouple) for temperature measurement;
- d) upper temperature limit;
- e) rated current and overload current of specimens;
- f) measurements and requirements;
- g) any deviation from the standard test method.

Annexe A (informative)

Considération de base pour la mesure et le graphique du courant de surcharge

La capacité de supporter un courant de surcharge est influencée par une variété de particularités (de conception et d'utilisation) et elle est limitée par la température maximale permise pour le contact, par son revêtement, par le type de sortie, par le boîtier, etc.

L'augmentation maximale de température t_b sous le courant de surcharge peut être calculée par:

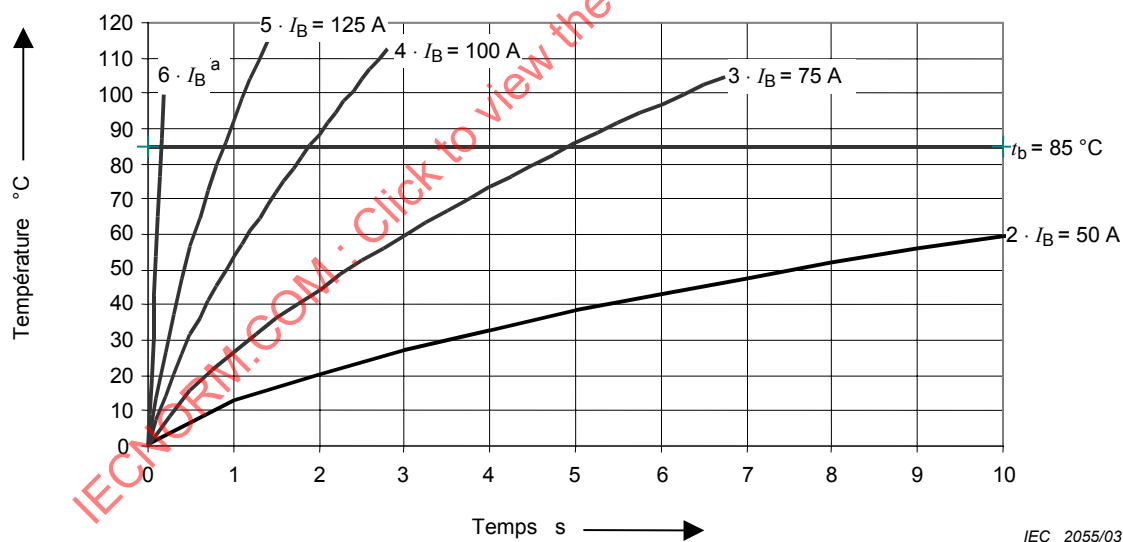
$$t_b = t_u - t_e$$

où

t_u est la limite supérieure de température du connecteur selon la spécification particulière;

t_e est la température maximale d'environnement autorisée du connecteur dans les conditions de son utilisation.

Les diagrammes suivants ont été mesurés et tracés à titre d'exemple.



^a Courant de surcharge, multiple entier du courant assigné I_B .

Figure A.1 – Augmentation de température en fonction du temps et du courant

Avec les courbes température – temps et l'augmentation de température maximale t_b (dans la Figure A.1 ci-dessus $t_b = 85\text{ °C}$), les valeurs de temps et de courant sont utilisées pour tracer la Figure A.2 à double échelle logarithmique.